Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0410U004951

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-12-2010

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Струк Андрій Ярославович
2. Struk Andrij Jaroslavovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 30-10-2010

Спеціальність за освітою: 8.070102

Місце роботи здобувача: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 76.051.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Тема дисертації:

1. Особливості формування дифракційного контрасту дислокацій та їх комплексів в кристалах Si у секційній та проекційній Х-променевій топографії

2. The peculiarities of the diffraction contrast of the dislocations and their complexes in Si crystals in the sectional and projectional X-ray topography

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена дослідженню механізмів і закономірностей формування дифракційних зображень на Х-хвильових топограмах дислокацій, дислокаційних петель та їх комплексів у залежності від їх місцеположення в кристалі кремнію та наявності макродеформацій. Виявлено особливості формування товщинних осциляцій інтенсивності - поблизу лінії дислокації виникає просторове квазіперіодичне хвильове поле з макроперіодом в декілька екстинкційних відстаней. Досліджено вплив комбінованого поля деформацій від дислокацій та макроскопічних пружних деформацій на просторові розподіли інтенсивності в палатці Бормана.

2. The thesis is dedicated to the investigation of the mechanisms and laws of the X-ray diffraction images formation of dislocations and dislocation loops and their complexes in Si crystals with respect to their placement

and availability of macro-deformation fields. The influence of the combined distortions from the dislocations and the external macro-deformation fields on the dimensional distribution of the in-tensity was investigated. The contribution and role of different mechanisms in the dislocation images formation were investigated with respect to their lo-cation, size and character of the change of the total deformation fields.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Фодчук Ігор Михайлович
2. Fodchuk Igor Myhajlovych

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Молодкін Вадим Борисович
2. Молодкін Вадим Борисович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Максимяк Петро Петрович
2. Максимяк Петро Петрович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Мельничук Степан Васильович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Мельничук Степан Васильович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.